

СООБЩЕНИЯ Объединенного института ядерных исследований дубна

K 84

P13-88-882

1988

# В.В.Круглов, М.В.Никитин

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КАМЕРЫ С МЕДЛЕННЫМ ДРЕЙФОМ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕЖИМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧАСТИЦ

#### ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время метод идентификации заряженных частиц, основанный на измерении их ионизирующей способности в области логарифмического роста ионизации, активно применяется в экспериментальной физике высоких энергий. Особенно широкое распространение получили ионизационные детекторы, в которых идентификация осуществляется путем многократного измерения полных потерь энергии в тонких слоях газа (см., например,  $^{/1,2/}$ ). Детекторы этого типа обладают многими достоинствами, однако большие флуктуации полных потерь энергии не позволяют создавать компактные идентификаторы. Необходимость использовать в реальном детекторе многие тысячи амплитудных каналов электроники также создает, по крайней мере в настоящее время, значительные трудности.

Измерение первичной ионизации в газе методом счета кластеров в камере с медленным продольным дрейфом электронов<sup>/9/</sup> позволяет, в принципе, избавиться от упомянутых выше недостатков.

К настоящему времени опубликован ряд работ <sup>/4+7/</sup>, посвященных изучению метода счета кластеров. Большинство исследований выполнено на частицах с фиксированной ионизирующей способностью. Это либо электроны от радиоактивного источника <sup>90</sup> Sr , либо заряженные частицы от ускорителя. Релятивистский рост первичной ионизации измерен только в работах <sup>/4,7/</sup>

Низации измерен только в расста. Здесь следует отметить одно из достоинств р/а-источника "Sr для подобного рода исследований, а именно: ионизирующая способность электронов от этого источника почти точно соответствует минимуму ионизационной кривой (отличие не превышает 0,5%). Наряду с этим простота работы с р/а-источниками, в отличие от работы на пучках заряженных частиц от ускорителей, делает <sup>90</sup>Sr очень удобным.

Таким образом, полный цикл необходимых измерений проводится не во всех работах. В этих условиях способность детектора идентифицировать частицы авторы оценивают только на основании распределения числа зарегистрированных импульсов для частиц с одной ионизирующей способностью, в случае р/а-источника <sup>90</sup>Sr — в минимуме ионизационной кривой. При этом полагают, явно или неявно, что детектор будет идентифицировать частицы в соответствии с теоретической кривой релятивистского роста.

DOBERSHEETING TOT TOT 回過20月137 1

Однако существует, как нам кажется, простой метод, который позволяет довольно точно экспериментально смоделировать измерение ионизационной кривой и при использовании источника частиц с фиксированной ионизирующей способностью, в частности, р/а-источника <sup>90</sup> Sr

Ниже изложено обоснование этого метода и иллюстрация его практического применения.

### ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА

Схема камеры с медленным дрейфом для счета кластеров (МДкамера) традиционной конструкции приведена на рис. 1 (указанные на рисунке размеры относятся к камере, которая использовалась в настоящих исследованиях).



Рис. 1. Схема МД-камеры для счета кластеров. 1 — область медленного дрейфа; 2 — регистрирующая пропорциональная камера.

Напомним принцип регистрации первичной ионизации в МД-камере. При прохождении через область (1) заряженная частица образует вдоль своего

трека некоторое количество электронных сгустков — кластеров первичной ионизации. Под действием слабого электрического поля кластеры медленно дрейфуют из области (1) в область (2), представляющую собой обычную пропорциональную камеру, с помощью которой они регистрируются. Таким образом, в принципе, если каждый кластер дает только один сигнал в пропорциональной камере, то количество зарегистрированных сигналов соответствует величине первичной ионизации, созданной частицей.

Рассмотрим случай прохождения через камеру двух типов частиц, которые создают в газе камеры кластеры первичной ионизации с плотностью n<sub>1</sub> и n<sub>2</sub> соответственно. При фиксированной скорости дрейфа v<sub>др</sub> в области (1) частота прихода кластеров в регистрирующий элемент (2) есть

$$J_1 = n_1 \cdot v_{dp}$$
  $\mu$   $J_2 = n_2 \cdot v_{dp}$ . (1)

Величина первичной ионизации для этих двух типов частиц, измеряемая в камере, определяется как число импульсов  $N_i$ , зарегистрированных в течение промежутка времени  $[t_1, t_2]$ , т.е.

$$N_1 = J_1 \cdot (t_2 - t_1)$$
 w  $N_2 = J_2 \cdot (t_2 - t_1)$ . (2)

Из формул (1) и (2), очевидно, следует, что все различие в ионизирующей способности частиц, с точки зрения ее измерения в камере, проявляется только как различие в частоте прихода кластеров в регистрирующий элемент камеры. Следовательно, имеется возможность смоделировать условия регистрации первичной ионизации с плотностью n<sub>2</sub> через первичную ионизацию с плотностью n<sub>1</sub>, а именно

$$J_2 = n_2 \cdot v_{dp} = n_1 \cdot \left[\frac{n_2}{n_1} \cdot v_{dp}\right] = n_1 \cdot v_{dp}^2$$
 (3)

Таким образом, необходимо просто изменить скорость дрейфа  $v_{\rm дp}$  на  $v'_{\rm dp} = \frac{n_2}{n_1} \cdot v_{\rm dp}$  и проводить регистрацию кластеров в течение того же интервала времени  $[t_1, t_2]$ .

До сих пор наше рассмотрение носило упрощенный характер, поскольку мы совсем не касались вопросов, связанных с процессом переноса кластеров в МД-камере. А именно, существуют различия между случаем, когда требуемая величина  $J_2$  создается частицей с ионизирующей способностью  $n_2$  при скорости дрейфа  $v_{\rm дp}$ , и случаем, когда такая же величина  $J_2$  создается частицей с ионизирующей способностью  $n_2$  при скорости дрейфа  $v_{\rm dp}$ , и случаем, когда такая же величина  $J_2$  создается частицей с ионизирующей способностью  $n_1$  при  $v'_{\rm np}$ .

Рассмотрим эти различия.

1. Влияние диффузии. При изменении скорости дрейфа изменяется величина коэффициента диффузии электронов в газе. Диффузия, как известно<sup>187</sup>, оказывает существенное влияние на процесс измерения первичной ионизации методом счета кластеров. Именно под влиянием диффузии кластерная структура, созданная пролетевшей частицей, с течением времени разрушается. Рассмотрим это явление применительно к настоящему случаю.

Известно, что диффузию вдоль направления дрейфа Х можно описать гауссовым распределением со среднеквадратичным отклонением

$$\sigma_{\rm X} = \sqrt{\frac{2{\rm D}_{\rm L} \cdot {\rm X}}{{\rm v}_{\rm AP}}} = \sqrt{2{\rm D}_{\rm L} \cdot {\rm t}_{\rm AP}}, \qquad (4)$$

где D<sub>L</sub> — коэффициент продольной диффузии; t<sub>др</sub> — время дрейфа.

Поскольку измерение числа кластеров проводится в течение одного и того же интервала времени  $[t_1, t_2]$ , то необходимо проанализировать только величину  $D_L$ .

Диффузия электронов в газах подробно рассмотрена в книге <sup>/9/</sup>. Наиболее просто проводится анализ коэффициента поперечной диффу, зии, который выражается формулой:

$$D_{T} = \frac{1}{3} < \ell_{e}(v) \cdot v > , \qquad (5)$$

где  $\ell_e$  — средняя длина свободного пробега электронов между столкновениями с молекулами газа; v — скорость электронов, которая складывается из тепловой и дрейфовой скоростей.

Усреднение в формуле (5) проводится по скоростям электронов.

Скорость теплового движения электронов при температуре t = = 18°C равна v<sub>тепл.</sub> = 11,5 см·мкс<sup>-1</sup>. Типичная величина скорости дрейфа в данной методике v<sub>дp</sub>  $\leq$  1 см·мкс<sup>-1</sup>. Поскольку отношение плотности ионизации в минимуме ионизационной кривой n<sub>min</sub> и на плато Ферми n<sub>F</sub> для известных газов n<sub>F</sub> /n<sub>min</sub>  $\leq$  1,5, то максимальное изменение v<sub>дp</sub> в предлагаемом методе  $\Delta v_{qp} \leq$  0,5 см·мкс<sup>-1</sup>. Так как

$$(\Delta v_{gp} \leq 0.5 \text{ cm·mkc}^{-1}) \ll (v_{Tenn} = 11.5 \text{ cm·mkc}^{-1}),$$

то можно считать, что коэффициент диффузии D<sub>T</sub> (см. (5)) меняется незначительно.

К сожалению, коэффициент продольной диффузии  $D_L$  имеет более сложный по сравнению с формулой (5) вид и не поддается в общем виде столь простому анализу. Однако вывод о слабом изменении диффузии остается справедливым и для величины  $D_L$ . Действительно, расчет  $\sigma_X$  по экспериментальным данным (см. /10,11/) показывает, что изменение  $\sigma_X$  при требуемом изменении скорости дрейфа не превышает 10% для большинства газов.

2. На процесс измерения первичной ионизации большое влияние оказывает пространственное разрешение  $\rho$  вдоль направления дрейфа в дрейфовом промежутке МД-камеры. Пространственное разрешение  $\rho$  определяется величиной мертвого времени  $r_{\text{м.в.}}$  в канале регистрации кластеров

(6)

 $\rho = v_{gp} \cdot \tau_{M,B}$ .

В работе  $^{/8/}$  было показано, что при правильном выборе величины  $\rho$  влияние диффузии на измеряемую первичную ионизацию устраняется.

Пусть первичная ионизация создается частицами с различной ионизирующей способностью. В этом случае при фиксированной скорости дрейфа величины  $\rho$  и  $\sigma_X$  не меняются, а среднее расстояние между кластерами  $\Delta X$  является величиной переменной. Соответственно соотношение между  $\rho$  и  $\sigma_X$  сохраняется, а соотношение между  $\rho$  и  $\Delta X$  изменяется в зависимости от изменения ионизирующей способности частиц.

В случае моделирования ситуация оказывается совершенно иной, что связано с неизменным соотношением между  $\sigma_{\rm X}$  и  $\Delta {\rm X}$ . В связи с этим к выбору величины  $r_{\rm M-B}$  при моделировании предъявляются противоречивые требования.

Действительно, с одной стороны, для сохранения соотношения между  $\rho$  и  $\sigma_{\rm X}$  мертвое время необходимо изменять в соответствии с формулой

$$\tau'_{\text{M.B.}} = \frac{v_{\text{AP}}}{v'_{\text{AP}}} \cdot \tau_{\text{M.B.}}$$
(7)

С другой стороны, при таком изменении  $\tau_{M.B.}$  остается неизменным соотношение между  $\rho$  и  $\Delta X$ , чего нет в случае облучения камеры частицами с различной ионизирующей способностью.

Для того, чтобы разрешить эту противоречивую ситуацию, не поддающуюся простому анализу, мы воспользовались результатами работы <sup>/8/</sup>, в которой было проведено математическое моделирование процесса измерения первичной ионизации в МД-камере.

На рис. 2 приведены зависимости числа зарегистрированных кластеров (N), созданных в 10 мм аргона частицами с γ-фактором, равным 4 (кривая 1) и 1000 (кривая 2), т.е. в минимуме ионизационной кривой и на плато Ферми, от величины ρ.

В предлагаемом методе моделирования измерение числа кластеров производится на участке трека, длина которого изменяется пропорционально изменению ионизирующей способности частицы. Т.к. в аргоне отношение  $n_{\gamma=1000}/n_{\gamma=4} = 1,36$ , то мы должны построить зависимость  $1,36 \cdot N_{\gamma=4}$  от  $\rho$ . Эта зависимость представлена на рис. 2 кривой 3.

Поскольку в данном случае при моделировании измерения следует проводить при  $v'_{\rm дp} = 1,36 \cdot v_{\rm дp}$ , то необходимо сделать масштабное преобразование кривой 3 по оси  $\rho$  в соответствии с формулой (6) и сравнить преобразованную таким способом кривую с кривой 2.

4



Рис. 2. Зависимость числа зарегистрированных кластеров N от величины пространственного разрешения  $\rho$  в МД-камере, наполненной аргоном. Кривая 1 – для частиц с  $\gamma = 4$  ( $N_{\gamma=4}$ ); кривая 2 – для частиц с  $\gamma = 1000$ ( $N_{\gamma=1000}$ ); кривая 3 – зависимость 1,36 ·  $N_{\gamma=4}$ ; кривая 4 – зависимость, полученная масштабным преобразованием по  $\rho$  кривой 3.

Криван 4 на рис. 2 представляет результат такого преобразования кривой 3 с масштабным коэффициентом 1,36, что соответствует неизменной величине мертвого времени в процессе моделирова-

ния. На рисунке видно достаточно хорошее совпадение кривых 2 и 4 при  $\rho > 50$  мкм. Хотя при меньших величинах  $\rho$  расхождение становится заметным, эта область  $\rho$  практически не реализуется на практике.

Таким образом, из проведенного выше анализа следует вывод, что мертвое время, определяющее пространственное разрешение МДкамеры, при изменении v<sub>др</sub> в процессе моделирования должно быть неизменным.

При фиксированном  $\tau_{M,B}$  будет естественно изменяться соотношение между  $\rho$  и  $\sigma_X$ . Однако оказывается, что в интересующем нас диапазоне значений  $\rho$ ,  $\sigma_X$  и  $\Delta X$  это изменение несущественно. Для предельного случая отсутствия диффузии выбор фиксированного значения  $\tau_{M,B}$ , очевиден.

Закончив обоснование выбора фиксированного мертвого времени, сделаем небольшое замечание. Как можно заметить, в работе <sup>/8/</sup> анализ проведен в предположении, что мертвое время  $r_{M,B}$  имеет фиксированную величину. Отсюда следует, что МД-камера вместе с регистрирующей электроникой должна быть прибором с непродлевающимся мертвым временем. Поскольку собственно МД-камера имеет продлевающееся мертвое время, то мертвое время должно определяться регистрирующей электроникой. Причем электронное мертвое время должно быть заметно больше мертвого времени собственно МД-камеры, чтобы последнее не являлось определяющим. В противном случае результаты работы<sup>/8/</sup> использовать некорректно. 3. В принципе имеется некоторое различие в распределении кластеров по количеству электронов в них в зависимости от  $\gamma$ -фактора ионизирующей частицы. Например, данные для аргона при  $\gamma = 4$  и  $\gamma = 1000$  приведены в  $^{/8/}$ . Однако это различие, по нашему мнению, столь незначительно, что им можно пренебречь.

4. Эффективность счета кластеров зависит от времени жизни электронов в газе, которое определяется в основном их прилипанием либо к молекулам основного газа, либо к электроотрицательным примесям. Но поскольку измерения проводятся в течение одного и того же интервала времени  $[t_1, t_2]$ , то этот эффект также не сказывается на применимости предлагаемого метода.

5. Так как кластеры попадают из области медленного дрейфа в регистрирующую пропорциональную камеру через проволочный катод, то эффективность их регистрации зависит от его прозрачности <sup>/12/</sup>. Прозрачность зависит от соотношения напряженностей поля до катода и после него. В принципе, при неизменном напряжении на пропорциональной камере, изменение напряжения на дрейфовом промежутке с целью изменения скорости дрейфа может приводить к изменению прозрачности. Оценка прозрачности катода показывает, что как в нашем конкретном случае, так и в большинстве других изменение дрейфового напряжения в требуемых пределах никак не сказывается на регистрации кластеров. Но даже если в некотором случае окажется, что прозрачность катода меняется, то это изменение всегда может быть учтено.

Таким образом, проведенный выше анализ показывает, что предлагаемый метод с довольно высокой степенью точности моделирует облучение МД-камеры, работающей в режиме идентификатора, частицами с различной ионизующей способностью.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ МЕТОДА

Исследование работы МД-камеры проводилось на стенде, который включал в себя кроме камеры телескоп из двух сцинтилляционных счетчиков. В качестве ионизующих частиц использовались электроны от р/а-источника <sup>90</sup>Sr. Телескоп давал временную отметку ( $t_0 = 0$ ) о прохождении частицы через камеру. Сигналы с камеры усиливались токовым усилителем ( $I_{nopor} = 0,5$  мкА; полоса = 100 МГц), формировались по длительности и подавались на вход счетчика КС-021<sup>/13/</sup>,

который открывался на время измерений [t<sub>1</sub>,t<sub>2</sub>] . МД-камера в настоящих измерениях продувалась изобутаном с добавкой 8% ацетона при атмосферном давлении. Напряжение питания регистрирующей пропорциональной камеры U<sub>K</sub> = 4 кВ. Была выбрана скорость дрейфа  $v_{\rm дp} = 0,25$  см. мкс<sup>-1</sup>. Мертвое время формирователя, формирующего сигналы с камеры, было выбрано  $r_{\rm M-B} = 25$  нс. Этому соответствует пространственное разрешение  $\rho = v_{\rm дp} \cdot r_{\rm M-B} = 62,5$  мкм. Измерения проводились в течение интервала [t<sub>1</sub> = 2 мкс, t<sub>2</sub> = 6 мкс], т.е. с одного сантиметра вдоль трека.

Мы здесь не будем комментировать выбор конкретных величин приведенных выше параметров, поскольку это является предметом специального обсуждения.



Рис. 3. Зависимость среднего числа кластеров  $\bar{N}_t$ , зарегистрированных в интервале времени [2, 6] мкс от скорости дрейфа.

На рис. З приведена зависимость среднего числа кластеров  $\bar{N}_t$ , зарегистрированных в течение интервала времени [2 мкс, 6 мкс], от скорости дрейфа. Экспериментальные точки хорошо описываются прямой линией. Следует, однако, заметить, что при экстраполяции к  $v_{gp} = 0$  прямая не проходит через точку  $\bar{N}_t = 0$ , как должно было бы быть. По-видимому, это связано с наличием посторонних импульсов, причина по-

явления которых нам не ясна. Экспериментальные точки, обозначенные на рисунке символами р, К,  $\pi$ , е и соответствующие ионизующей способности протонов, каонов, ционов и электронов с импульсом р = 5 ГэВ/с, нанесены в предположении, что п<sub>г</sub>/n<sub>min</sub> = 1,4. Экспериментальные данные о зависимости первичной ионизации от *у*-фактора для нашей газовой смеси отсутствуют.

На рис. 4 приведены результаты экспериментального моделирования измерения первичной ионизации для каонов и пионов с импульсом 5 ГэВ/с в идентификаторе длиной 64 см. Каждое событие в гистограмме было образовано простым суммированием импульсов для 64 независи-



Рис. 4. Результат экспериментального моделирования измерения первичной ионизации для каонов (К) и пионов ( $\pi$ ) с импульсом 5 ГэВ/с в идентификаторе длиной 64 см. Пунктирной стрелкой помечено теоретическое положение пионного пика.

мых прохождений электронов от р/а-источника <sup>90</sup>Sr . При этом скорости дрейфа выбирались в соответствии с рис. 3. Измерения, результаты которых приведены на рис. 4, заняли время более суток. Оказалось, что суточные колебания температуры заметно влияют на процентное содержание ацетона в газовой смеси. Это, в свою очередь, существенно сказывается на стабильности результатов измерений. Принятые меры позволили в значительной мере снизить влияние температурных колебаний, однако не устранили его полностью. В результате гистограммы на рис. 4 оказались примерно на 10% шире, чем должны были бы быть.

Авторы благодарны В.В.Карпухину за помощь и консультации при создании электронной аппаратуры экспериментального стенда; Л.Г.Афанасьеву и С.В.Трусову за помощь в разработке программного обеспечения; Д.М.Хазинсу и Б.Ситару за полезные обсуждения.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Мерзон Г.И., Ситар Б., Будагов Ю.А. ЭЧАЯ, 1983, т.14, вып.3, с.648.
- 2. Будагов Ю.А. и др. Ионизационные измерения в физике высоких энергий, М.: Энергоатомиздат, 1988.

3.	Walenta A.H.	- IEEE Trans.	on Nucl.Sci.,	, 1979,	, vol. NS-26, p.73.
----	--------------	---------------	---------------	---------	---------------------

- 4. Rehak P., Walenta A.H. IEEE Trans. on Nucl. Sci., 1980, vol. NS-27, p.54.
- 5. Будагов Ю.А. и др. ПТЭ, 1984, №1, с.62.
- 6. Будагов Ю.А. и др. Сообщение ОИЯИ, 13-84-337, Дубна, 1984.
- 7. Поляков В.А., Рыкалин В.И. Препринт ИФВЭ, ОЭФ 87-124, Серпухов, 1987.
- 8. Lapique F., Piuz F. Nucl.Instr. and Meth., 1980, vol.175, p.297.
- 9. Хаксли Л., Кромптон Р. Диффузия и дрейф электронов в газах. М.: "Мир", 1977.
- 10. Comminchau V. et al. DESY 84 049, 1984.
- 11. Peisert A., Sauli F. CERN 84 08, 1984.
- 12. Bunemann O. et al. Canadian Journal of Research, 1949, vol.27, sec.A, p.191.
- 13. Выонг Дао Ви и др. ОИЯИ, 10-81-755, Дубна, 1981.

НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ?

Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, если они не были за-казаны ранее.

<b>0 1</b> 77.17	
Груды Аї Международного симпозиума по ядерной электронике. Братислава, Чехословакия, 1983.	4р. 50 к.
Труды 7 Международного совещания по проблемам квантовой теории поля. Алушта, 1984.	4 р. 30 к.
Труды VII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1984.	5 р. 50 к.
Труды Ш Международного симпозиума по избранным проблемам статистической механики. Дубна, 1984: (2 тома)	7р. 75 к.
Труды Международного совещания по аналитическим вычислениям на ЭВМ и их применению в теоретической физике. Дубна, 1985.	4 р. 00 к.
Труды XII Международного симпозиума по ядерной электронике. Дубна, 1985.	4 р. 80 к.
Труды Международной школы по структуре ядра. Алушта, 1985.	3р. 75 к.
Труды V Международной школы по нейтронной физике Алушта, 1986.	4 р. 50 к.
Труды IX Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1984. (2 тома)	13 р. 50 к.
Труды VIII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома)	7 р. 35 к.
Труды VIII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома) Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома)	7 р. 35 к. 13 р. 45 к.
Труды VIII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома) Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома) Труды Международной школы-семинара по физике тяжелых ионов. Дубна, 1986.	7 р. 35 к. 13 р. 45 к. 7 р. 10 к.
Труды VIII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома) Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома) Труды Международной школы-семинара по физике тяжелых ионов. Дубна, 1986. Труды Совещания "Ренормгруппа - 86". Дубна, 1986.	7 р. 35 к. 13 р. 45 к. 7 р. 10 к. 4 р. 45 к.
Труды VIII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома) Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома) Труды Международной школы-семинара по физике тяжелых ионов. Дубна, 1986. Труды Совещания "Ренормгруппа - 86". Дубна, 1986. Труды Международного совещания по теории малочастичных и кварк-адронных систем. Дубна, 1987.	7 р. 35 к. 13 р. 45 к. 7 р. 10 к. 4 р. 45 к. 4 р. 30 к.
Труды VIII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома) Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома) Труды Международной школы-семинара по физике тяжелых ионов. Дубна, 1986. Труды Совещания "Ренормгруппа - 86". Дубна, 1986. Труды Международного совещания по теории малочастичных и кварк-адронных систем. Дубна, 1987. Труды VIII Международного совещания по проблемам квантовой теории поля. Алушта, 1987.	7 р. 35 к. 13 р. 45 к. 7 р. 10 к. 4 р. 45 к. 4 р. 30 к. 3 р. 55 к.
<ul> <li>Труды VIII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома)</li> <li>Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома)</li> <li>Труды Международной школы-семинара по физике тяжелых ионов. Дубна, 1986.</li> <li>Труды Совещания "Ренормгруппа - 86". Дубна, 1986.</li> <li>Труды Международного совещания по теории малочастичных и кварк-адронных систем. Дубна, 1987.</li> <li>Труды VIII Международного совещания по проблемам квантовой теории поля. Алушта, 1987.</li> <li>Труды II Международного симпозиума по проблемам взаимодействия мюонов и пионов с веществом. Дубна, 1987</li> </ul>	7 p. 35 κ. 13 p. 45 κ. 7 p. 10 κ. 4 p. 45 κ. 4 p. 30 κ. 3 p. 55 κ. 4 p. 20 κ.
	<ul> <li>электронике: Братислава, чехословакия, 1985.</li> <li>Труды 7 Международного совещания по проблемам квантовой теории поля. Алушта, 1984.</li> <li>Труды VII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1984.</li> <li>Труды Ш Международного симпозиума по избранным проблемам статистической механики. Дубна, 1984. (2 тома)</li> <li>Труды Международного совещания по аналитическим вычислениям на ЭВМ и их применению в теоретической физике. Дубна, 1985.</li> <li>Труды XII Международного симпозиума по ядерной электронике. Дубна, 1985.</li> <li>Труды Международной школы по структуре ядра. Алушта, 1985.</li> <li>Труды V Международной школы по нейтронной физике Алушта, 1986.</li> <li>Труды IX Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частип. Дубна, 1984. (2 тома)</li> </ul>

Рукопись поступила в издательский отдел 21 декабря 1988 года.

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79. Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований.